

- 1. Статистическая проверка гипотез: основные типы гипотез и общая логическая схема статистического критерия; характеристики качества критерия.
- 2. Проверка статистических гипотез.
- 3. Критическая область. Мощность критерия.
- 4. Отношение правдоподобия и лемма Неймана-Пирсона.
- 5. Пример построения наиболее мощного критерия.
- 6. Проверка гипотез об определенных значениях параметров нормальных распределений.
- 7. Проверка гипотезы о равенстве средних при известной дисперсии.
- 8. Проверка гипотезы о равенстве средних при неизвестной дисперсии.

Статистическая гипотеза — это предположение о виде распределения и свойствах случайной величины в наблюдаемой выборке данных.



Простая и сложная статистические гипотезы

Простая гипотеза, в отличие от сложной, полностью определяет теоретическую функцию распределения случайной величины.

Например,

- 1. гипотезы «вероятность появления события в схеме Бернулли равна 1/2»,
- 2. «закон распределения случайной величины нормальный с параметрами a=0, $a^2=1$ »
- 3. «вероятность появления события в схеме Бернулли заключена между 0,3 и 0,6»,
- 4. «закон распределения не является нормальным»

Простая – это гипотеза содержащая только одно предположение.

Сложная – гипотеза состоящая из конечного или бесконечного числа простых гипотез.

Проверяемую гипотезу называют *нулевой* (основной), обозначают её H_0 .

Выдвинутая гипотеза может быть принята или отвергнута.

Наряду с выдвинутой гипотезой H_0 рассматривают и противоречащую ей гипотезу, которую называют конкурирующей (альтернативной) и обозначают H_1 .

В зависимости от выборочных данных принимается либо основная гипотеза, либо конкурирующая.

Задача: проверить, верна ли нулевая гипотеза H_0 при альтернативной гипотезе H_1 ?

Гипотеза <i>H</i> ₀	Принимается	Отвергается
Верна	Правильное решение	Ошибка 1-го рода
Неверна	Ошибка 2-го рода	Правильное решение

Обозначим через α — вероятность допустить ошибку 1-го рода, через β — 2-го рода.

Вероятность α допустить ошибку 1-го рода, то есть отвергнуть верную гипотезу H_0 , называют уровнем значимости.

Общая схема проверки статистических гипотез

1 этап

Задаём уровень значимости α .

 α – вероятность ошибки 1-го рода (ошибочно отвергнуть верную гипотезу)

В качестве α обычно берётся малое значение: 0.05, 0.01, 0.005, 0.001.

2 этап

Строим случайную величину K, называемую статистическим критерием, для которой выполняются следующие условия:

- 1) она является функцией от выборочных данных: $K=K(x_1,x_2,...,x_n)$;
- 2) её значения позволяют судить о «расхождении выборки с гипотезой H_0 », то есть о том, надо принимать или отвергать гипотезу H_0 ;
- 3) распределение этой величины известно.

3 этап

Вычисляем значения критерия, подставляя в него выборочные данные. Это число называют *наблю- даемым значением критерия* и обозначают $K_{\text{набл}}$.

4 этап

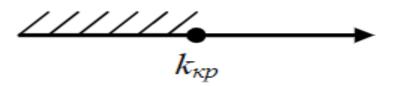
Находим *критическую область* данного критерия, то есть совокупность значений критерия, при которых нулевую гипотезу отвергают.

Все остальные значения критерия образуют область, называемую *областью принятия гипотезы*.

Если наблюдаемое значение критерия попадает в критическую область, то гипотезу отвергаем, если в область принятия гипотезы, то принимаем. Точки, которые отделяют критическую область от области принятия гипотезы, называют критическими точками.

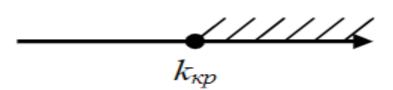
Чаще всего встречаются следующие виды критических областей:

а) левосторонняя



$$K \leq k_{\kappa p}$$

б) правосторонняя



$$K > k_{\kappa p}$$

в) двусторонняя

$$k_{\kappa p}^{1}$$
 $k_{\kappa p}^{2}$

$$K \leq k_{\kappa p}^{-1}$$

$$K > k_{\kappa p}^2$$

Критическую область W целесообразно находить согласно следующим требованиям:

- 1. $p(K \in W) = \alpha$
- **2.** вероятность β ошибки 2-го рода минимальная, то есть вероятность $(1-\beta)$ максимальная

Вероятность $(1-\beta)$ не допустить ошибку 2-го рода, то есть отвергнуть гипотезу H_0 , когда она неверна, называется *мощностью* критерия.

- 1. $p(K \in W) = \alpha$
- 2. мощность критерия максимальная



Схема проверки статистических гипотез

- 1. Задаём уровень значимости.
 - зависит от «тяжести последствий» ошибок 1-го и 2-го рода для каждой конкретной задачи
- 2. Строим статистический критерий.
 - для каждой гипотезы имеет свой вид
 - описаны в литературе

- 3. Вычисляем наблюдаемое значение критерия.
 - подставляем в формулу выборочные данные
- 4. Находим критическую область и проверяем, попадает ли в неё наблюдаемое значение критерия.
 - критическая область зависит от вида конкурирующей гипотезы
 - критические точки находятся по специальным таблицам или с помощью компьютера

Критерий Стьюдента

Известно, что генеральная совокупность распределена по нормальному закону, но его параметры неизвестны.

$$a, \sigma$$
 — параметры распределения

$$M(X) = a$$

Проверить гипотезу: $H_0: a = a_0$

$$H_0: a = a_0$$

 a_0 — некоторое число

Критерий:

$$T = \frac{\overline{x_e} - a_0}{\sqrt{n}} \cdot \sqrt{n}$$

$$\overline{x_e}$$
 — выборочная средняя

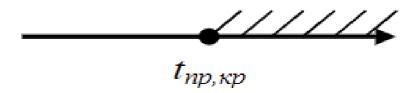
s — исправленное среднее

квадратическое отклонение

T имеет распределение Стьюдента с (*n*-1) степенями свободы

1. $H_1: a > a_0$

Критическая область W – правосторонняя:



F(x) — функция распределения Стьюдента с (n-1) степенями свободы

$$F(t_{np,\kappa p}) = 1 - \alpha \quad \Rightarrow \quad t_{np,\kappa p} = F^{-1}(1 - \alpha)$$

2. $H_1: a < a_0$

Критическая область W – левосторонняя:



F(x) — функция распределения Стьюдента с (n-1) степенями свободы

$$F(t_{\text{nee},\kappa p}) = \alpha \implies t_{\text{nee},\kappa p} = F^{-1}(\alpha)$$

3. $H_1: a \neq a_0$

Критическая область W — двусторонняя:

$$t_{1,\kappa p}$$
 $t_{2,\kappa p}$

F(x) — функция распределения Стьюдента с (n-1) степенями свободы

$$t_{2,\kappa p} = F^{-1}(1-\alpha/2), \qquad t_{1,\kappa p} = -t_{2,\kappa p}$$
 или $t_{1,\kappa p} = F^{-1}(\alpha/2), \qquad t_{2,\kappa p} = -t_{1,\kappa p}$

Пример.

Проектный контролируемый размер изделий, изготовляемых станком-автоматом, $a = 35 \, mm$. Измерения 20 случайно отобранных изделий дали следующие результаты:

x_i	34.8	34.9	35.0	35.1	35.3
n_i	2	3	4	6	5

Требуется при уровне значимости 0.05 проверить нулевую гипотезу H_0 : a = 35 при конкурирующей гипотезе H_1 : $a \neq 35$.

x_i	34.8	34.9	35.0	35.1	35.3
n_i	2	3	4	6	5

$$n = 20$$
$$\alpha = 0.05$$

$$H_0$$
: $a = 35$ H_1 : $a \neq 35$

$$H_1: a \neq 35$$

$$a_0 = 35$$

$$T = \frac{\overline{x_e} - a_0}{s} \cdot \sqrt{n}$$

 $T = \frac{\overline{x_s} - a_0}{s} \cdot \sqrt{n}$ $\overline{x_s} - \text{выборочная средняя}$ s - исправленное среднееквадратическое отклонение

$$\overline{x_s} = 35.07$$
 $S = 0.16$
 $T_{\text{Habs}} = \frac{35.07 - 35}{0.16} \cdot \sqrt{20} \approx 1.96$

Критическая область двусторонняя:

$$\frac{1111}{1.96}$$
 $\frac{1111}{1.96}$ $\frac{1111}{1.96}$

Принимаем нулевую гипотезу, то есть станок обеспечивает проектный размер изделий.